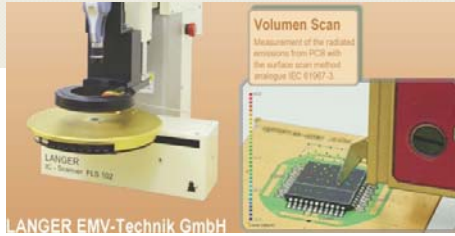


EMCスキャナテスタ FLS102/103

LANGER
EMV-Technik



磁気ノイズ発生状況を高精度に解析

EMC Scanner Tester FLS102/FLS103

FREQUENCY RANGE 10 MHz TO 3GHz

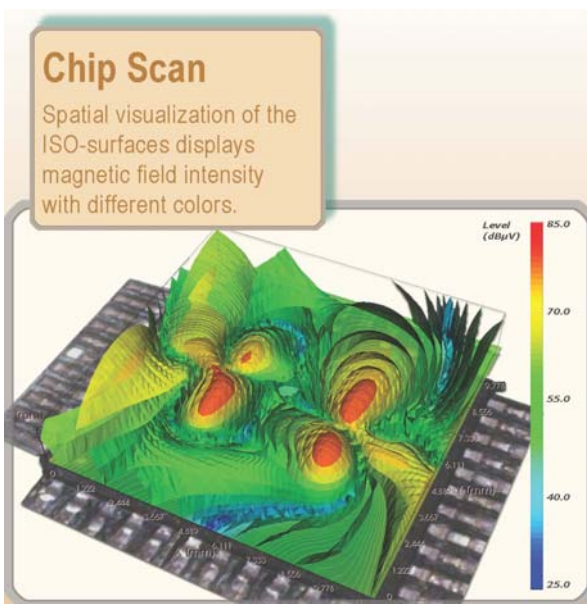
特徴

□PCBやIC部品等から発生している(電)磁界の分布を、近傍(電)磁界プローブを走査して高分解能測定します。

□PCBやIC部品等に複雑な凹凸があっても、至近距離で近傍(電)磁界アンテナが自動トレースするため高感度測定が可能。

□専用の解析ソフトにより、2D、3D表示によるノイズ発生状況等を詳細に解析可能。

□IEC 61967-3 表面走査法に準拠



□測定周波数レンジ 10MHz – 3GHz

□プリアンプ使用時 30dB / 500hm

□各種ニアフィールドマイクロプローブ

E Filed Probe / ICR E 150 Resolution 65 µm / 150 µm x 35 µm

H Filed Probe / ICR HH150 Resolution 80 µm / 150 µm

H Filed Probe / ICR HV150 Resolution 100 µm / 150 µm

□構成

測定には、スペクトラムアナライザ及びWindows PCが必要となります。

* 詳細スペック、カスタム仕様についてはお問い合わせください。



ウェーブクレスト株式会社

〒336-0021 埼玉県さいたま市南区别所1-27-5 プレム武蔵浦和7F

Tel. 048-764-9969 Fax. 050-3488-9847 Email. info@wavecrestkk.co.jp

EMCスキャナテスト FLS102/103

LANGER
EMV-Technik

項目		FLS102	FLS103	
可動テーブル部	動作範囲	X / Y軸	200 / 150 mm	300 mm
		Z軸	50 mm	100 mm
		回転軸	+/- 180°	+/- 180°
	位置精度	X / Y軸	20 μm	10 μm
		Z軸	20 μm	10 μm
		回転軸	1°	1°
	リピータビリティ	X / Y軸	+/-20 μm	+/-10 μm
		Z軸	+/-20 μm	+/-10 μm
		回転軸	+/- 1°	+/- 1°
	最大スピード	X / Y軸	500 mm/s	800 mm/s
		Z軸	200 mm/s	320 mm/s
		回転軸	90° /s	90° /s
	外形寸法		325 x 450 x 450	560 x 640 x 910
重量		12 kg	40 kg	
統合制御	制御用PC	Windows PC	Windows PC	
コントローラ部	ソフトウェア	ChipScan	ChipScan	
電源	コントロール	RS232	RS232 又は USB	
	AC電源入力	110 / 230V	110 / 230V	

◎参考

半導体のEMI評価方法はIEC61967: Integrated Circuit, Measurement of Electromagnetic Emissions, 150kHz to 1GHzで規格化を検討しています。これらは直接EMIを測定するのではなくEMIを駆動する波源を評価します。システムで問題となるEMIの発生および伝搬は様々であるのでそれに対応するように5種類の測定方法(IEC 61967-2~6)が提案されています。

IEC 61967-3 は、Surface Scan 法 放射性雑音 (radiated emission)の測定法の一つとして提案されています。



ウェーブクレスト株式会社

〒336-0021 埼玉県さいたま市南区别所1-27-5 プレム武蔵浦和7F

Tel. 048-764-9969 Fax. 050-3488-9847 Email. info@wavecrestkk.co.jp



ICスキャナ ICS103



- アクセサリ(オプション)
- ・ビデオ・マイクロスコープ
 - ・E&Fフィールド用 ICR ニア・フィールド・マイクロプローブ

IC Scanner ICS103

chip Scan & Pin Scan

LANGER IC-Scanner ICS 103



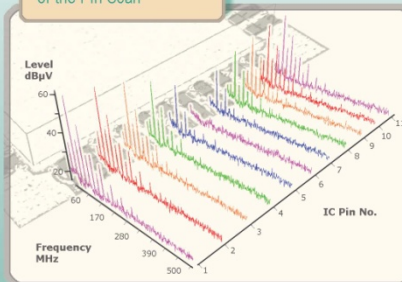
Measurement of
radiated fields
over an IC or DIE
IEC 61967-3



LANGER EMV-Technik GmbH

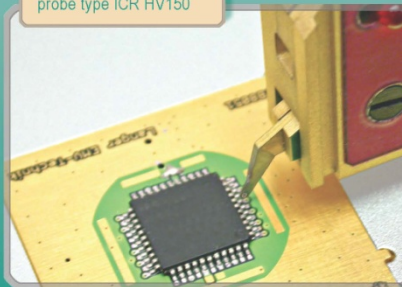
ChipScan

3D view of the
measured spectra
of the Pin Scan



Pin Scan

ICR probe moves
from pin to pin with
probe type ICR HV150

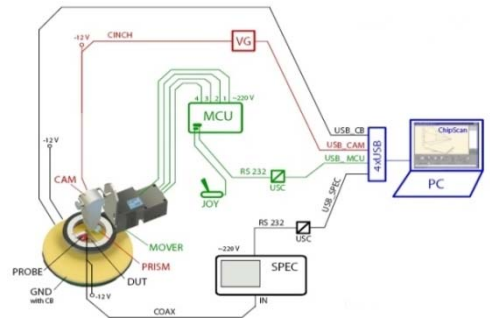


ピンスキャン

ICRプローブをピンからピンに移動。
プローブタイプ:ICR HV150

チップスキャン

ピンスキャンの測定データを3Dで表示



ウェーブクレスト株式会社

〒336-0021 埼玉県さいたま市南区别所1-27-5 プレム武蔵浦和7F

Tel. 048-764-9969 Fax. 050-3488-9847 Email. info@wavecrestkk.co.jp

ICスキャナ ICS103

LANGER
EMV-Technik

項 目		ICS103	
可動テーブル部	動作範囲	X / Y軸	25 mm
		Z軸	25 mm
		回転軸	+/- 180°
	位置精度	X / Y軸	5 μm
		Z軸	5 μm
		回転軸	1°
	リピータビリティ	X / Y軸	+/-1 μm
		Z軸	+/-1 μm
		回転軸	+/- 1°
	最大スピード	X / Y軸	5 mm/s
		Z軸	5 mm/s
		回転軸	90° /s
外形寸法		320 x 220 x 270	
重量		27 kg	
統合制御	制御用PC	Windows PC	
コントローラ部	ソフトウェア	ChipScan	
電源	コントロール	RS232	
	AC電源入力	110 / 230V	



ウェーブクレスト株式会社

〒336-0021 埼玉県さいたま市南区别所1-27-5 プレム武蔵浦和7F

Tel. 048-764-9969 Fax. 050-3488-9847 Email. info@wavecrestkk.co.jp